

## 南台科技大學 102 學年度第 2 學期課程資訊

課程名稱	奈米材料結構分析
課程編碼	10M02801
系所代碼	01
開課班級	博研機電一甲 碩研機械一甲碩研奈米一甲碩研能源一甲
開課教師	王聖璋
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	三 1 2 3 教室 K007
必選修	選修
課程概述	材料顯微結構分析是材料科學中最為重要的研究方法之一。準確、快捷的分析結果為材料的製備工藝、材料性能微結構表徵研究及其材料顯微結構設計提供可靠的實驗和理論依據。本課程主要介紹包括材料顯微結構形貌觀察、物相種類確定及其定量分析、微晶及納米粉體尺寸測定、塊材料及其微區成分分析和定量測定等；同時側重介紹進行上述顯微結構分析通常所採用的各種現代儀器的主要功能特性及其分析方法，其中包括 X 光繞射儀(XRD)、穿透式電子顯微鏡(TEM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、電子探針(EPMA)、波譜儀(WDS)、能譜儀(EDS)、X 光螢光分析儀(XRF)等，並且按排了相應的實驗。
課程目標	瞭解包括 X 光繞射儀(XRD)、穿透式電子顯微鏡(TEM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、電子探針(EPMA)、波譜儀(WDS)、能譜儀(EDS)、X 光螢光分析儀(XRF)等的原理與基本理論，並熟習其實務分析方法。
課程大綱	1. 簡介 -什麼是奈米科技 ? -如何檢測奈米材料 2. 晶體結構 (I) -基本晶體理論 3. 晶體結構(II) -反晶格空間 4. 晶體結構(III) -立體投影 5. X 光繞射分析技術 6. 電子束繞射分析技術
英文大綱	1. Introduction -What is the nanotechnology ? -How to characterize the nanophasse materials 2. Crystal Structure (I) -Basic theory of crystal

	3. Crystal Structure (II) -Reciprocal lattice 4. Crystal Structure (III) -Stereographic projection 5.X-Ray Characterization (I)
教學方式	
評量方法	
指定用書	Elements of X-Ray Diffraction
參考書籍	
先修科目	
教學資源	
注意事項	
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	